

CHARACTERIZATION OF CRYSTAL GROWTH DEFECTS BY X-RAY METHODS

教客网 • 百万图书阅读与交易网站 (www.jiaoke.com)

《CHARACTERIZATION OF CRYSTAL GROWTH DEFECTS BY X-RAY METHODS》是由D. KEITH BOWEN编著的精品图书，由PLENUM PRESS出版。教客网提供的图书交易、电子书在线阅读与PDF下载服务，支持电脑、平板和手机多终端访问，涵盖教材、教辅、文学、科技、艺术等多个领域，是读者查找和收藏图书资源的实用平台。

书名	CHARACTERIZATION OF CRYSTAL GROWTH DEFECTS BY X-RAY METHODS
作者	D. KEITH BOWEN
出版社	PLENUM PRESS
ISBN	
出版日期	1980-01-01
页数	589
价格	
关键词	CHARACTERIZATION OF CRYSTAL GROWTH DEFECTS BY X-RAY METHODS, D. KEITH BOWEN
分类	

本书出售、求购与在线阅读地址: <https://www.jiaoke.com/book/detail/40941003.html>

更多相关图书推荐: 首页: <https://www.jiaoke.com>
D. KEITH BOWEN 其他作品: <https://www.jiaoke.com/book/detail/40941003.html>
PLENUM PRESS 出版图书: <https://www.jiaoke.com/book/detail/40941003.html>
关键词搜索: CHARACTERIZATION OF CRYSTAL GROWTH DEFECTS BY X-RAY METHODS: <https://www.jiaoke.com/book/detail/40941003.html>

教客网 提供大量电子书免费在线阅读与 PDF
下载服务，支持按书名、作者、出版社、ISBN、标签等多维度检索图书资源。